# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出額公告

#### ⑫ 特 許 公 輟(B2) ✓昭63 - 13226

@Int Cl.4

فم از د خار

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和63年(1988)3月24日

G 06 F 15/62

460

6615-5B

発明の数 1 (全7頁)

図発明の名称

指紋照合装置

②特 顧 昭54-98966 ❸公 開 昭56-24675

砂出 願 昭54(1979)8月2日 ❸昭56(1981)3月9日

**29発明** 者 浅

# 紘 東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

砂出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 人 弁理士 内 原 픕

査 官 田村 審 征

1

2

#### 砂特許請求の範囲

1 探索すべき指紋特徴と、少なくとも一つ以上 のフアイル指紋特徴とを照合する装置において、 前記各指紋特徴の構成要素である特徴点群に対 し、特徴点群各点の局所座標系の各象限に存在す る近傍特徴点をリレーション関係を用いて再構成 するリレーション連結部と、再構成された指紋特 徴を保持する探索特徴記憶部及びフアイル特徴記 憶と、前記特徴記憶に保持された各特徴点データ を順次読出し、位置、方向、リレーションを比較 10 して対となる特徴点群を検出する対検査部と、前 記対検査部で検出された対特徴点群を保持する対 特徴記憶部と、前記対特徴記憶部に保持された対 特徴点群と前記探索特徴記憶部及びフアイル特徴 から指紋の一致性を判定する照合判定部からな り、近傍特徴点間の隆線数を特徴量とするリレー ションを含む指紋特徴によつて対となる特徴点群 を検出することを特徴とする指紋照合装置。

#### 発明の詳細な説明

この発明は、指紋等の縞状パターンから構成さ れた紋様の同一性を、その紋様特徴によつて照合 する装置に関するものである。

従来、指紋の照合は指紋を構成する隆線紋様の 点(端点)M,mo,mi及び分岐又は合流する点 (分岐点) m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub>を特徴点とし、その位置X<sub>1</sub> Y及び方向Dをコード化したものを特徴として特 開昭50-10525号及び特開昭53-12235号公報に記

載されている如く、これら特徴点の配置関係を検 査することにより行われている。しかしながら、 探索されるべき指紋(以後探索指紋と呼ぶ)と、 多数の照会されるべきフアイル指紋(以後フアイ 5 ル指紋と呼ぶ)との特徴点の照合を行なう際に、 上記採索指紋特徴点とフアイル指紋特徴点の全て あるいは、位置X、Y及び方向Dを了じめ設定さ れた変動内に限定した組合せで照合させる従来の 方法では次の点で問題がある。

犯罪現場に残された遺留指紋のように、採取さ れる指紋印象が部分的であり特徴点が少数の場 合、多量のフアイル指紋と照合させると、類似指 紋との分離が困難となる。

遺留指紋には押捺時の紋様変形が大きく、これ 記憶部に保持されている再構成された指紋特徴と 15 をX,Y,Dの変差で一致させようとする大きな 変動を許容する閾値を設定せざるを得ないが、こ の時類似指紋との分離が増々劣化する。このよう に低品質の押捺指紋あるいは遺留指紋を、多数の フアイル指紋の照合に際して、特徴点の位置X。 20 Y及び方向Dのみの照合では困難な場合が多い。 一方、現在指紋鑑識官が指紋の照合鑑定を行って いる方式の重要な特徴の一つに各特徴点間の隆線 数がある。例えば第1図を参照して、注目する1 特徴点Mの方向Dによる局所座標系x, yに於け 特徴点、即ち第1図において、 路線Kの端切れる 25 る各象限の最近傍特徴点 mo, mi, m2, m1との それぞれの隆線数ro, ri, rz, rs(これらを以後リ レーションと呼ぶ)を新たな特徴として用いるこ とにより照合の精度が格段に向上される。一例を あげれば、第2図に示すように特徴点M.と特徴

点Moを有する二つの指紋は、その特徴点Moo。 Muを中心として位置及び方向が相似関係にあつ ても、それぞれのリレーションを検査すれば異な る指紋であることが判定される。さらに、1特徴 つて求められる集密量Cは、将徴点Mに於ける集 密性を表わしており、リレーション抽出時に副次 的に容易に求められるとともに、リレーションの 擬似的な代表値の性格を有している。即ちro~rs が小さいとき集密量では大きくなる場合が多い。10 ら構成される。 また集密量では、これが異なる特徴点は「対」と はなり得ないという意味から「対」特徴検査の判 定量として採用できる。

リレーション特徴及び集密量は、位置X, Y及 る量であつて照合時に位置X, Y及び方向Dの一 致検出と独立に検査することができる。

上記リレーションが指紋紋様パターンが与えら れたとき、自動的に検出可能であることは先の特 る)で記載された通りである。

またリレーションを利用する特徴点の一致検出 を目的とした照合方法には特願昭50-158757号明 細書(特開昭52-82163号公報)及び特願昭50-る提案があるが、これらの方式で定義される連結 関係が紋様の変形に対し変動し易い点及び1特徴 点の連結関係の最大抽出数が不定であるためフア イル指紋の情報構成に難点があつた。

紋様を特徴付ける各特徴点の位置X、Y及び方向 Dとともに各特徴点により固有に決定される局所 座標系を複数個の扇形領域に分割した近傍に於け る最近傍点と上記特徴点との隆線数即ちリレーシ い照合を可能にするものである。

次に実施例を参照して本発明の詳細を説明す る。第3図は、本発明の一実施例のプロック図を 示すものであり、それぞれフアイル指紋を記憶す 指紋特徴点を1指紋分づつ読取り一時記憶3に格 納するフアイル読取部2、一時記憶3に格納され た特徴点データによりリレーションを持いて最近 傍特徴点データを連結合成し、これが探索指紋の

ときは探索特徴記憶5へ、またフアイル指紋のと きはフアイル特徴記憶 6 に格納するリレーション 連結部4、探索特徴記憶5及びフアイル特徴記憶 8とから「対」となるべき特徴点を位置、方向及 点Mを中心とする一定領域内の他の特徴点数によ 5 びリレーションによつて検査する「対」検査部 7、「対」であると判定された探索指紋特徴点と フアイル指紋特徴点のそれぞれを特徴点番号によ つてテーブル状に格納する「対」特徴記憶 B、及 び特徴点による照合を実行する照合判定部8とか

全体の動作は次のように説明される。外部の特 徴抽出装置(図には示さない)から探索指紋の特 徴点データは、フアイル装置1に一時記憶され信 号12を介してフアイル読取部2によつて読取ら び方向Dを記述する座標系とは関係なく決定され 15 れるか、又は直接フアイル読取部2に供給され、 いづれの場合にも信号22でアドレスされる一時 記憶3の記憶部分に信号21を介して格納され る。このときの一時記憶3の内容の内記述的デー タ301には人名、指種等の指紋固有示標、特徴 願昭54-39648号明細審(本願と同一出願人によ 20 点数等が示めされており信号 3 3 を介して照合判 定部9に送出される。照合判定部9は、探策すべ き指紋の記述的データ301を照合結果出力のた めに保持する。一方、一時配憶3の特徴点データ 302は第4図に示されるように特徴点種別Q、 158758号明細書(特開昭52-82164号公報)によ 25 集密量C、位置X, Y方向D及び隆線数r、特徴 点番号mからなるリレーションRo, Ri, Ra, Ra を1特徴点として、複数(n+1)点分からなつ ており、これを信号31を介してリレーション連 結部4に出力する。リレーション連結部4は、第 本発明の目的は、指紋等の照合に際して、指紋 30 5 図に示される如く、第4図で例えばリレーショ ンRoの場合、特徴点番号moをアドレス44に出 力し一時記憶3を読出して、Mºを中心とする局 部座標系により位置x。,y。及び方向d。に変換し、 隆線数r₀とともに探索特微記憶5に信号41及び ヨンを検査することにより安定で、かつ精度の高 35 アドレス 42 によつて格納する。位置xo, yoJ方 向doの紋様パターン上の意味は第1図に示した如 くである。他のリレーションR<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>につい ても同様の処理が行われ、探索特徴記憶5に格納 される。特徴点データ302の全特徴点データに るフアイル装置 1、フアイル装置 1からフアイル 40 対して上記処理が施されると、第5図に示す形式 の特徴記述が探索特徴記憶5に完成する。リレー ションRo,Ri,Ra,Raは第1図に示した如く、 中心特徴点Mに関する局所座標系の各象限に於け る扇形領域の最近傍特徴点mo, mi, m2, m,に

よつて決定される。中心特徴点Mに対するリレー ションは上記局所座標系に於いてこれを複数角に 分割する扇形領域の各領域に1づつ定義されるも ので、本発明は各象限即ち4角に分割する実施例 について説明するが、以下に説明する内容から他 5 の分割数の実施も容易に理解できるところであ る。

以上のようにして、探索特徴記憶5への探索特 徴データの格納が終了すると、フアイル読取部 2 1から信号21を介してフアイル・アドレス23 を制御することにより順次読出し、探索指紋の場 合と同様にしてリレーション連結を行いその結果 を信号41アドレス43によつて、フアイル特徴 データがフアイル特徴記憶 8 に格納される毎に、 探索特徴データ及びフアイル特徴データは「対」 検査部7で、その特徴点の全ての組合せが信号 5 1, 8 1を介して読出され、それぞれ、位置、方 向、リレーションの「対」検査で予め定められた 20 レジスタ401の左端から信号4011によって 閾値内である場合のみ、第6図で示される如くそ の特徴点番号「対」M<sup>3</sup>, M<sup>1</sup>が信号71、アドレ ス72によつて「対」特徴記憶8に書込まれる。 この場合、探索指紋特徴点M³、フアイル指紋特 徴点M『を示す。

照合判定部のはアドレス91によつて「対」特 徴記憶8から信号81を介して探索指紋及びフア イル指紋の特徴点番号「対」を得、これに基づく アドレス82,83によつて探索特徴記憶5及び フアイル特徴記憶6から必要な特徴点データを読 30 数発生器404は、その出力4041,4042 出し、2つの指紋の一致性を照合判定する。フア イル指紋1指の照合判定が終了すると信号90を 介して次のフアイル指紋の読取りがフアイル読取 装置2によつて開始せられ、読取られるべき全て のフアイル指紋の読取りが終了したとき探索指紋 35 の照合判定が完結する。

各処理部はその動作開始終了を互に連結し同期 をとるために信号20,40,70及び90によ つて連結されている。

要を示したが、これら各処理部の内フアイル装置 1、フアイル読取部2については当業者がすでに 衆知である適当な磁気デイスク装置、あるいは磁 気テープ装置等で良く、説明を娶しない。

次に第7図を参照してリレーション連結部4の 一実施例について説明しよう。

第7図を参照してリレーション連結部4はシフ トレジスタ401、X, Y, D-レジスタ402 X, Y, D、加算器 4 0 7 X、減算器 4 0 3 X, Y, D及び407Y、乗算器405X, Y、40 8 X, Y、円関数発生器 4 0 4 及び制御回路 4 0 0で構成されており、次のように動作を行う。

一時記憶3のまづ第1の特徴点即ち、第4図 は、照合すべき第一の特徴データをフアイル装置 10 M°の特徴点データが信号31を介してシフトレ ジスタ**40**1にRo, Ri, Rz, Ri, X, Y, Dー レジスタ402X, Y, DにそれぞれX, Y, D がセツト信号4001によつてセツトされる。同 時に、この内のQ, C, X, Y, Dのみは信号4 記憶 8 に格納する。順次読出されるフアイル特徴 15 1を介して、アドレス42によつて指定される探 案特徴記憶5又はリアイル特徴記憶6の第5図で 示されるQ, C, X, Y, Dに書込される。また Qは信号4000を介して制御回路400に入力 され、特徴点であることが確認された後、シフト 第1のリレーション特徴点番号moを入力し、こ れによつてアドレス44を出力し、その特徴点デ ータを信号31を介して読出す。読出されたリレ ーション特徴点データのうちX,Y,Dは、X, 25 Y, D-レジスタ402X, Y, Dの内容即ち中 心特徴点MºのX, Y, Dと、直ちに減算器40 3X, Y, Dでその差 $\Delta X$ 、 $\Delta Y$ 、 $\Delta D$ が算出さ れ、一方D一レジスタの内容によつて、例えば ROM(リードオンリメモリ) で構成される円関 に円関数値cosD、sinDを発生する。 4 つの乗算 器405X, Y 406X, Y及び加減算器40 7X, Yにより

### $x_0 = \Delta X \cos D + \Delta Y \sin D$ $y_0 = \Delta Y \cos D - \Delta X \sin D$

なる座標変換出力xo, yoが加算器 4 0 7 X、減算 器407Yから、又減算器403Dの出力として 方向doが得られ、シフトレジスタ401の左端に 信号4012によつて出力されている50とともに 以上でブロック図第3図によつて照合動作の概 40 第1のリレーション連結データro, xo, yo, doと して信号41を介して探索特徴記憶5又はフアイ ル特徴記憶8にアドレス42で指定される位置に 書込まれる。第1のリレーションRoの動作が終 了すると削御回路400はシフトパルス4002

をシフトレジスタ401に入力し、次の第2のリ レーションRiを左端に出力させ、上述の動作を 繰返えす。第4のリレーションR<sub>3</sub>の処理が終了 すると第5図の第1の特徴点Mºが完成したこと ション連結処理が終了すると制御回路400は信 号40によつて動作終了を「対」検出部7に出力。 し全ての動作を終了する。

業者に容易に実現できるもので詳細を省略する。 次に第8図を用いて「対」検出部7の詳細につ いて説明する。「対」検出部7は制御回路700、 絶対値減算器 7 0 1 R. X. Y. D、比較器 7 0

制御回路 4 0 の構成は上記動作説明によって当

2R, X, Y, D及び708閾値発生器703、 07、及びANDゲート706から構成されてお り、次のような動作を行う。

リレーション連結部 4 からのフアイル特徴記憶 5への格納助作終了信号 4 0 を制御回路 7 0 0 が 探索特徴記憶5、フアイル特徴記憶 B に出力し第 1の特徴点データ即ち第5図のM°のC, X, Y, Dを探索/フアイルそれぞれから信号51,61 を介して読出し絶対値減算器 7 0 1 R. X. Y. **D及び比較器702R, X, Y, Dによって**  $|C_{s}-C_{t}| \leq T_{o}, |X_{s}-X_{t}| \leq T_{x},$  $|Y^s-Y^r| \leq T_{y_s} |D^s-D^r| \leq T_p$ 

> (Sは探索特徴配憶出力、Fはフアイル特 徴記憶出力を表わす。)

に供給される。この比較の閾値T。、Tx、Ty、T。 は閾値発生器703から供給される。上記全ての 比較が真のときのみANDゲート 7 0 6 の出力 7 060がONとなり制御回路700は、次に述べ OFFのときは、次のフアイル特徴点の読出しを 行う。リレーション比較を行う場合には、制御回 略700はリセツト信号7001を出力しカウン タ705,707を初期化するとともに、アドレ アイル特徴記憶 B から第1のリレーションro, xo, yo, doをそれぞれ読出し上記C, X, Y, D と同様にして絶対値減算器701R, X, Y, D 及び比較器 7 0 2 R, X, Y, Dによって

 $|r^s-r^r| \leq T_r, |x^s-x^r| \leq T_x,$  $|y^s-y^F| \leq T_{y_s} |d^s-d^P| \leq T_d$ を検査する。これら全比較が真のときANDゲー ト706はON 信号7060を出力し、制御回路 になる。この動作を繰返し、特徴点M"のリレー 5 700は、カウント信号7002を出力しカウン タ707を更新する。

たゞし、上記比較判定に先だつてご、ごが読出 された時点で隆線数コード検出器704はピ、rF のいづれかにリレーションが存在しない場合に設 10 定されているコードを検出しもし不在リレーショ ンがパ、パのいづれかに検出された場合はその結 果を信号7040を介して制御回路700に出力 するとともにカウンタ705を更新する。この場 合制御回路 700 は先の比較判定の結果に拘らず 隆線数コード検出器 7 0 4、カウンタ 7 0 5, 7 15 カウント信号 7 0 0 2 を出力しない。以上の動作 を第2~第4リレーション・データについて繰返 えす。第4のリレーション・データの処理が終了 すると制御回路700はカウンタ707の出力 を、カウンタ705の出力即ち、不在リレーショ 受けとると直ちにアドレス 73, 74 をそれぞれ 20 ン数によつて決定される閾値 7030 と比較器 7 08で比較しその出力7080がONのとき内部 保持している探索特徴点番号M®及びフアイル特 徴点番号M『を信号 7 1 を介して「対」特徴記憶 8にアドレス72とともに出力する。一対の処理 25 が終了すると制御回路700はアドレス74を更 新して、次のフアイル特徴点を読出し、また全フ アイル特徴点の読出しが終了するとアドレス73 を更新して次の探索特徴点を読出し、上記処理を 全探索及びフアイル特徴点「対」に対して行う。 が検査され、その比較出力がANDゲート 7 0 6 30 以上の結果として第 6 図の示した「対」特徴記憶 8の内容が完成する。

関値発生器703はそれぞれ上記動作で説明し た比較に必要な閾値を必要な時点で制御回路70 0の制御信号7003のもとに出力するコード発 るリレーション比較に入る。もし出力7080が 35 生器例えばROMでよく、また隆線コード検出器 704は単純な一致比較回路を組合せたものでよ い。制御回路700の構成は上記動作説明により 当業者に容易になし得るので詳細は省略する。

以上で本発明の主要部分について説明を終了し ス73,74を変更して、探索特徴記憶5及びフ 40 たが、照合判定部8については種々の照合判定装 置が考えられる。例えば特開昭50~55232号公報、 特開昭50-132838号公報あるいは特開昭53-12235号公報等の装置が使用できるがいづれに於 いても、特徴点の対を全組合せで検査するのでは

10

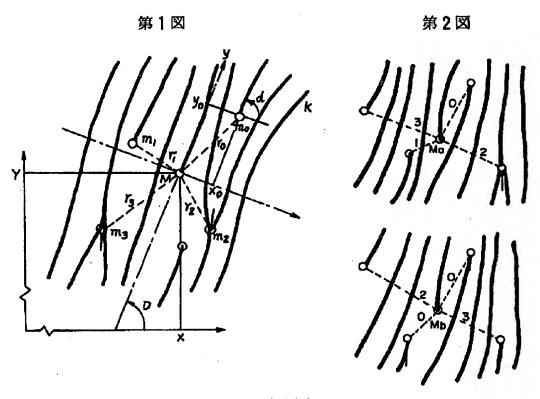
なく、「対」特徴記憶8に蓄積された探索特徴点 M<sup>s</sup>及びフアイル特徴点M<sup>f</sup>の組合せのみを照合判 定の入力とすることにより誤つた「対」を照合判 定の入力から削除することが可能となり、精度の 商い服合結果が得られる。

#### 図面の簡単な説明

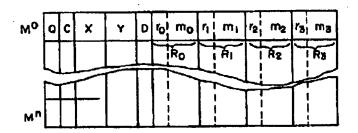
第1図は、指紋の特徴点及びリレーションの定 義を説明する図、第2図は特徴点の位置及び方向 が同一であつてもリレーションで異なる指紋であ 本発明の装置のブロツクを示す図、第4図は一時

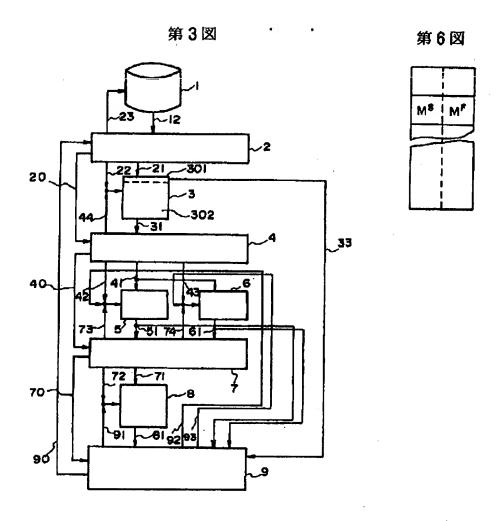
記憶3の内容を、第5図は探索及びフアイル特徴 記憶 5, 8の内容を、第6図は「対」特徴記憶 8 の内容を説明する図、第7図はリレーション連結 部4の詳細を説明するブロック図、第8図は 5 「対」検出部7の詳細を説明するブロック図であ る。

図において、1はフアイル装置、2はフアイル 読取部、3は一時記憶、4はリレーション連結 部、5は探索特徴記憶、8はフアイル特徴記憶、 ることが判定できることを説明する図、第3図は 10 7は「対」検出部、8は「対」特徴記憶、9は照 合判定部をそれぞれ示す。



第4図





第5図

